

La Spectrométrie de Masse d'Ions Secondaires (SIMS): un outil majeur pour l'étude de notre système solaire, les recherches biomédicales et le développement des nanomatériaux

Henri-Noël Migeon

Département "Science et Analyse des Matériaux" CRP-Gabriel Lippmann 41, rue du Brill L-4422 Belvaux

The nanometer scale





100 microns



Luxembourg/Nancy: 117 km

100 microns / 100 km = 10^{-9}

1nm / 1 m= 10-⁹

Outline

- 1. Ion/matter interaction : impinging and outgoing particles
- 2. Instrumentation
- 3. General capabilities Elemental range

Ion imaging Depth profiling 3D analysis

- 4. Applications Geochronology Biomed Nanomaterials
- 5. Future developments



Secondary Ion Mass

Spectrometry (SIMS) is based upon the sputtering of a few atomic layers from the surface of a sample induced by a "*primary ion*" bombardment. A primary ion impact triggers a cascade of atomic collisions. Atoms, molecule fragments and ions are ejected





Molecular Dynamics Simulations of Reactions Between Molecules: High Energy Particle Bombardment of Organic Films, R. S. Taylor and B. J. Garrison, Langmuir 11, 1220-1228 (1995).

C₆₀ bombardment - animation



Outline

- 1. Ion/matter interaction : impinging and outgoing particles
- 2. Instrumentation
- 3. General capabilities Elemental range

Ion imaging Depth profiling 3D analysis Sensitivity

- 4. Applications Geochronology Biomed Nanomaterials
- 5. Future developments



Secondary Ion Mass Spectrometry



André Guinier est né à Nancy où son père Philibert Guinier, membre de l'Académie des Sciences dans la section d'économie rurale, était directeur de l'École Forestière. Il entre à l'École Normale Supérieure en 1930 et prépare une thèse en cristallographie. Ses premiers travaux sont consacrés à la conception et à la réalisation d'une chambre de diffraction des rayons X qui permet d'étudier la diffusion des rayons X au voisinage immédiat du faisceau incident. C'est en étudiant les défauts cristallins que Guinier découvre (en même temps que Preston) ce que l'on a appelé les "zones de Guinier-Preston", zones de concentration de l'un des types d'atomes composant un alliage (le premier exemple fut Al-Cu). Ces "zones G-P" ont un grand intérêt en métallurgie.Après sa thèse soutenue en 1939, il propose le sujet de thèse de <u>Raimond Castaing</u> qui donnera lieu à la <u>Microsonde de Castaing</u>.

Raimond Castaing

(1921 - 1998)

Electron microprobe



Alfred Benninghoven Université de Münster



Georges Slodzian Université Paris-Sud Orsay

Static SIMS

Dynamic SIMS

Direct image ion microscope_

Méthode d'analyse locale chimique et isotopique 25

relation de Lagrange-Helmholtz, $\sqrt{\nabla}h_{\theta} \alpha = \sqrt{\nabla_1}h_i \alpha_i$ où α et α_i sont les ouvertures du côté objet et du côté image, complète cet ensemble de formules bien connues en optique (21).

Le dispositif de post-accélération constitue la première lentille de notre système téléobjectif, il donne de l'image virtuellel⁶, filtrée par le prisme une image réelle l₁ située près du foyer image F_i . Par contre, l'image du crossover C' est virtuelle et située en C_i .

b) Lentille de projection. — L'image I₁ a un grandissement trop faible pour être utilisée directement dans le convertisseur. Il faut associer au système de postaccélération une lentille supplémentaire qui projette l'image I_1 sur la cathode du convertisseur. Par ailleurs cette lentille donne du cross-over C_1 une image réelle C'_1 . Si, au niveau de C'_1 , on place l'écran fluorescent destiné à recevoir l'image électronique, on pourra donner au trou pratiqué dans l'écran pour laisser passer le faisceau d'ions, les dimensions du cross-over C'_1 : la surface utile de l'écran ne sera donc partiquement pas réduite par la présence du trou.

La lentille de projection est simplement constituée par une lentille électrostatique unipotentielle dont les carac-



Annales de Physique, 1964

Thèse G. SLODZIAN



MASSON ET C10, ÉDITEURS

Slodzian, Thèse (1964)



WORLD LEADER IN MICRO AND NANO ANALYSIS

Scientific Instruments for Research

The CAMECA instruments provide elemental and isotopic composition data from micron down to sub-nanometer scale and equip the most prestigious government and university labs as well as leading high tech industrial companies around the world. Analytical techniques include SIMS, EPMA and 3D Atom Probe, applications are most diverse: Earth & Planetary Sciences, Materials, Semiconductors, Life Sciences,...



Metrology Tools for Semiconductor

CAMECA develops in-fab and near-fab metrology equipments based on the LEXES and SIMS analytical techniques. Our tools have been adopted by top semiconductor manufacturers worldwide and address major thin film and new material process control issues including: elemental composition and thickness in substrates, thin or thick multilayers, ULE implants, dopant dosimetry...



Recent **news,** Upcoming events...

CEA-LETI orders the latest model in our LA-WATAP 3D Atom Probe series for the development of advanced microelectronic and photovoltaic devices. Read more >>

IMS 1280, leader in nuclear forensics: ITU KarsIruhe, Germany selects CAMECA's Ultra High Sensitivity SIMS for its benchmark performances in nuclear particle analysis. More on nuclear forensics >>

EXtremely Low Impact Energy SIMS: The IMS Wf achieves sub-nm depth resolution with new EXLIE configuration. Learn more >>

Come and meet us at: EMPG XIII, Toulouse, France, April 12-14 Full show schedule >>



Claude Allègre, prix Crawford (= prix Nobel de Géologie)



membre



Georges Slodzian









Outline

- 1. Ion/matter interaction : impinging and outgoing particles
- 2. Instrumentation
- 3. General capabilities Elemental range

Ion imaging Depth profiling 3D analysis

- 4. Applications Geochronology Biomed Nanomaterials
- 5. Future developments



Mass Spectrometry





Mass Spectrometry



Figure 2 - Spectre de masse par SIMS à temps de vol d'un dépôt de vitamine B12 (masse moléculaire 1 356) sur une plaque d'argent [2]

Ion imaging





Ion imaging

Carbure de tungstène

- Vérification de l'homogénéité du liant
- ↓ Diffusion dans le liant

Depth profiling

Depth profiling

The **depth resolution** is limited by:

- collision cascades (target atoms mixing)
- roughening effects (non-flat bottom crater)
- crater edge effects (crater walls)

High *depth* resolution requires low impact energy (250eV to 1keV) and convenient primary beam incidence angle

Depth profiling

3D analysis

3) Imaging + sputtering = 3D

Carbon in a Thin-Film Superconductor RAE (IMS 3f)

Outline

- 1. Ion/matter interaction : impinging and outgoing particles
- 2. Instrumentation
- 3. General capabilities Elemental range

Ion imaging Depth profiling 3D analysis

- 4. Applications Geochronology Biomed Nanomaterials
- 5. Future developments

Trace element mapping

Au- ion image

GOLD ANALYSIS IN ARSENOPYRITE

Arsenopyrite: FeAsS

Field of view 100 x 100 μm^2

Geochronology

Geochronology

SILICON ISOTOPES IN GLASS

BORON ISOTOPES IN TOURMALINE

OXYGEN ISOTOPES IN ZIRCON

Geochronology: Zircon radiodating

Zircon is one of the most useful geochronometers.

Zircon: ZrSiO₄

remarquably resistant material

✓ two clocks:

235U → 207Pb ($\lambda \sim 0.7$ billion years) 238U → 206Pb ($\lambda \sim 4.4$ billion years)

Oldest zircon: ~4.40 billion years (Australia) Age of the Earth: ~4.55 billion years

Outline

- 1. Ion/matter interaction : impinging and outgoing particles
- 2. Instrumentation
- 3. General capabilities Elemental range

Ion imaging Depth profiling 3D analysis

- 4. Applications Geochronology Biomed Nanomaterials
- 5. Future developments

Radiotoxicology / Nuclear medecine:

Imaging ¹²⁷I/ ¹²⁹I distribution in thyroid

Raster 60x60 μ m²

MCF-7 mammary carcinoma cell: use of halogenous markers

Incorporation of BrdU (bromodeoxyuridine), IdU (iododeoxyuridine) and 5FU (5-fluorouracile) compounds in the same cell.

The last four images are collected simultaneously from same sputtered volume (multi-collection).

Sample from Pr. P. Galle, S.C. 27 INSERM, Faculté de Médecine, Créteil, France

Pharmaco-toxicology:

Targeting melanin cells

- CN :proteins
- P :DNA

→ morphology
General Structure of BZA

$$= \underbrace{ \begin{array}{c} & & \\$$

J. L. Guerquin-Kern , Curie Institute, Paris

Bacteria

E.coli labelled with ^{15}N at time t = t₁

Natural abundance ¹⁴N 99,7% ¹⁵N 0,3%

Analyzed area : (12 x 12) μ m²

E.coli labelled with ¹⁵N at time t = t₂ > t₁

Bacteria destroyed by immune system

<u>Biology, Cosmetic</u>

Molecule C_xD_y

Incorporation of an isotopically (D) labelled active molecule in human hair Analyzed area : (80 x 80) µm²

Courtesy of L'Oreal

Hairs from St Hélène

Reference Hair

Hairs from St Hélène

¹⁵N: stable isotope tracer used in vegetal cells

Outline

- 1. Ion/matter interaction : impinging and outgoing particles
- 2. Instrumentation
- 3. General capabilities Elemental range

Ion imaging Depth profiling 3D analysi

- 4. Applications Geochronology Biomed Nanomaterials
- 5. Future developments

Nanomaterials

R&D in Semi conductors

Figure 3: 2.2keV boron implant in silicon analyzed with 150eV O2+ primary beam

Nanomaterials

Image depth profile in N-MOS gate: 3) Imaging + sputtering= 3D

Outline

- 1. Ion/matter interaction : impinging and outgoing particles
- 2. Instrumentation
- 3. General capabilities Elemental range

Ion imaging Depth profiling 3D analysis

- 4. Applications Geochronology Biomed Nanomaterials
- 5. Future developments

High resolution NanoSIMS 50 images of ¹²C¹⁴N and ¹³C¹⁵N of double-labelled Bacillus subtilis DNA combed on wafers without Cs deposition (top) and with prior Cs deposition (bottom). Field of view : (15x15) µm²

Centre de Recherche Public – Gabriel Lippmann

Belvaux, LUXEMBOURG

4 departments: EVA / IST / SAM / REA